走査型電子顕微鏡

電子線を試料に当て、試料の表面形状を観察することや出てくる X 線を検出することで定性分析ができる装置

[型式]

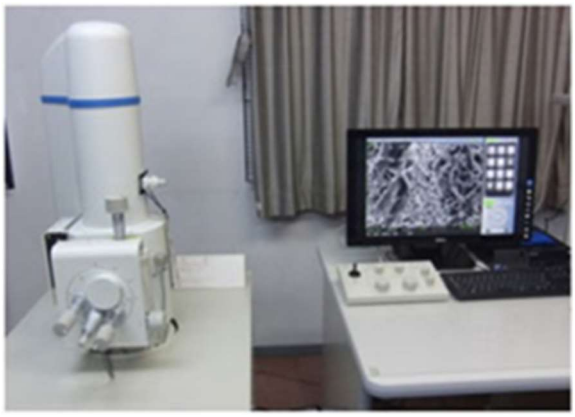
日本電子（株）　JSM-6010LA

[仕様]

分解能	：高真空モード（4 nm：20 kV）
	：低真空モード（5.0nm ：20kV）
加速電圧	：0.5～20kV
試料の大きさ	：φ120 mm×高さ 40mm 以内
倍率	：×5～300,000
定性分析可能元素	：B～U
前処理装置	：クロスセクションポリッシャ、蒸着装置

[設置年度]

2013 年度（平成 25 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日